

Theo yêu cầu của khách hàng, trong một năm qua, chúng tôi đã dịch qua 16 môn học, 34 cuốn sách, 43 bài báo, 5 sổ tay (chưa tính các tài liệu từ năm 2010 trở về trước) Xem ở đây

**DỊCH VỤ
DỊCH
TIẾNG
ANH
CHUYÊN
NGÀNH
NHANH
NHẤT VÀ
CHÍNH
XÁC
NHẤT**

Chỉ sau một lần liên lạc, việc dịch được tiến hành

Giá cả: có thể giảm đến 10 nghìn/1 trang

Chất lượng: Tao dựng niềm tin cho khách hàng bằng công nghệ 1. Bạn thấy được toàn bộ bản dịch; 2. Bạn đánh giá chất lượng. 3. Bạn quyết định thanh toán.

Tài liệu này được dịch sang tiếng việt bởi:

www.mientayvn.com

Từ bản gốc:

<https://drive.google.com/folderview?id=0B4rAPqlxIMRDNkFJeUpfVUtLbk0&usp=sharing>

Liên hệ dịch tài liệu :

thanhlam1910_2006@yahoo.com hoặc frbwrthes@gmail.com hoặc số 0168 8557 403 (gặp Lâm)

Tìm hiểu về dịch vụ: http://www.mientayvn.com/dich_tiang_anh_chuyen_nganh.html

Tại sao xác định tính chất phi tuyến quang học bằng kỹ thuật ghi ảnh là lựa chọn tốt nhất?

Chúng tôi chứng tỏ rằng đo trực tiếp bán kính chòm trong các thí nghiệm Z-scan dùng CCD camera tại đầu ra của một hệ ghi ảnh 4f cho độ nhạy cao và độ chính xác tốt hơn Baryscan. Một trong những ưu điểm là không nhạy với sự bất ổn hướng chùm laser xung bởi vì không dùng khe cứng như trong kỹ thuật Z-scan thông thường. Thêm vào đó, các tính toán số có liên quan ở đây và các phép đo bán kính chòm đơn giản bởi vì chúng ta không đo hệ số

truyền qua sau một khe và không có những khó khăn liên quan đến quá trình chuẩn hóa, đặc biệt khi ánh sáng nhiễu xạ thấp.

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[REDACTED]

[REDACTED]

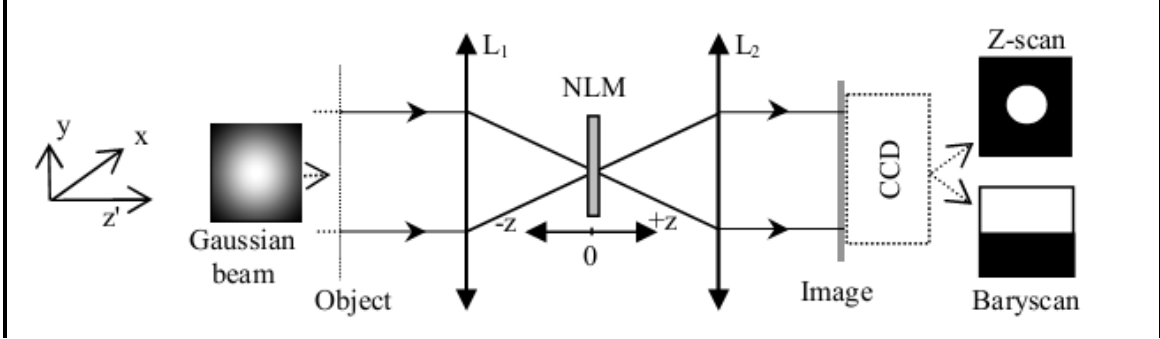
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

$$S(u,v) = \tilde{\mathcal{F}}[E(x,y)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} E(x,y) \exp[-j2\pi(ux + vy)] dx dy$$

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

$$\left| T(u, v, z) = \frac{S_L(u, v, z)}{S(u, v, z)} = \left\{ e^{\alpha L} [1 + q(u, v, z)] \right\}^{-1/2} \exp[j\Delta\phi_{NL}^{\text{eff}}(u, v, z)], \right. \quad (1)$$

[REDACTED]

[REDACTED]

$$\left| \omega_x = 2 \sqrt{\frac{\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} I(x, y) (x - \bar{x})^2 dx dy}{\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} I(x, y) dx dy}}, \text{ where } \bar{x} = \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} I(x, y) x dx dy}{\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} I(x, y) dx dy} \right. \quad (2)$$

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

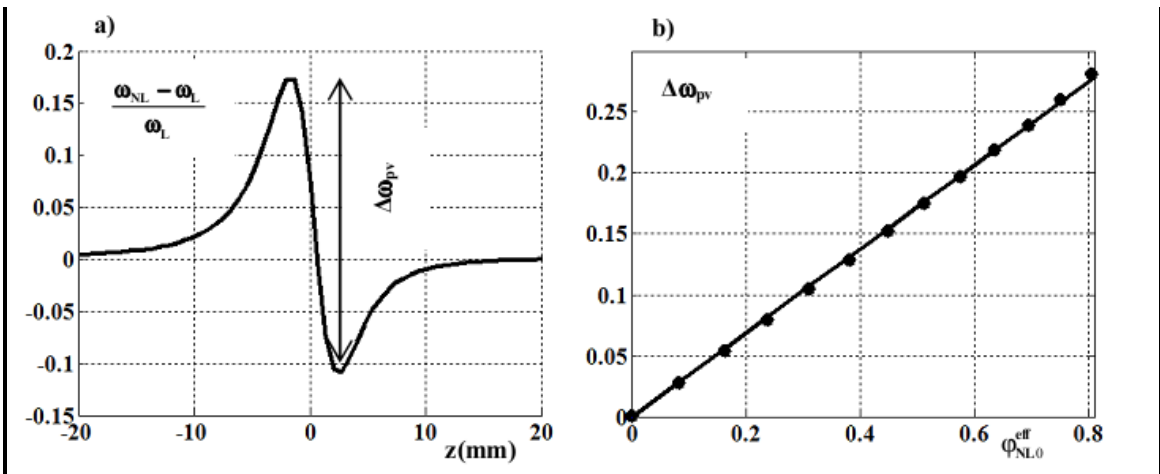
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

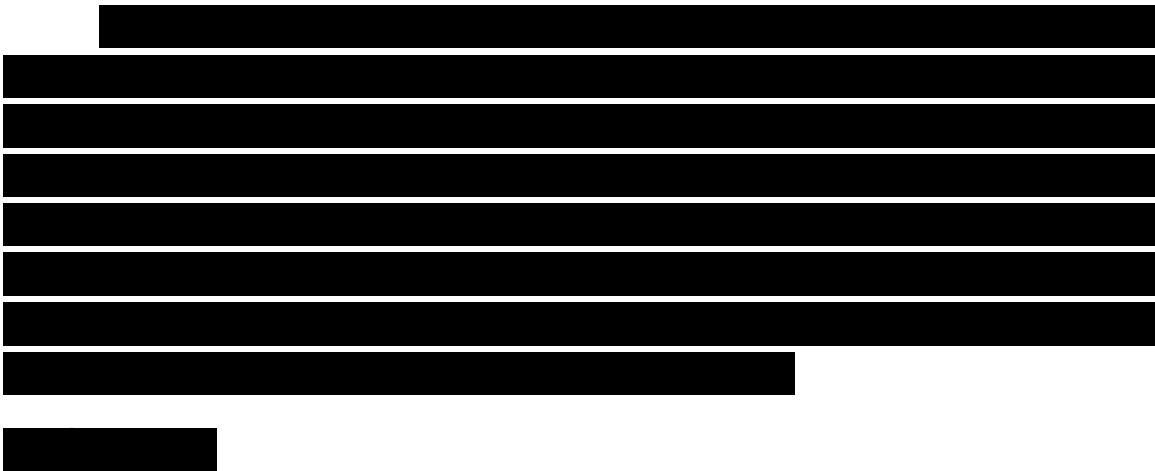
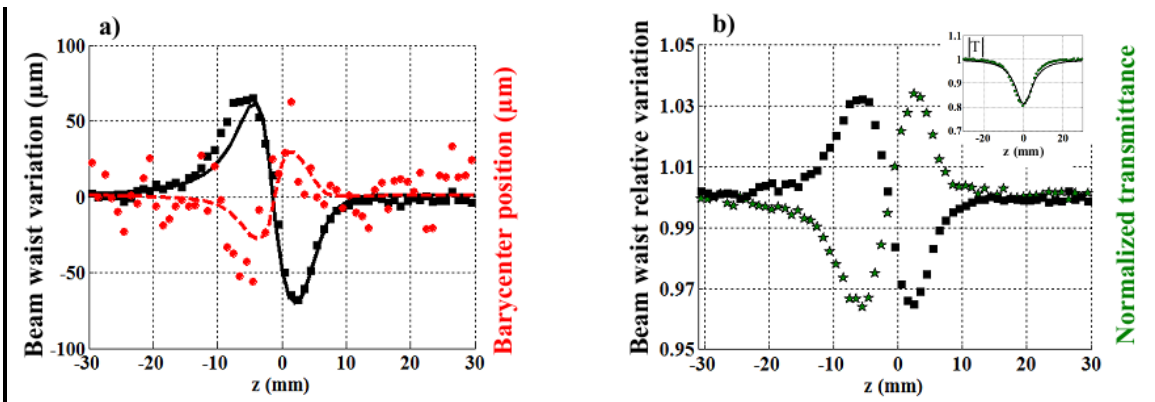
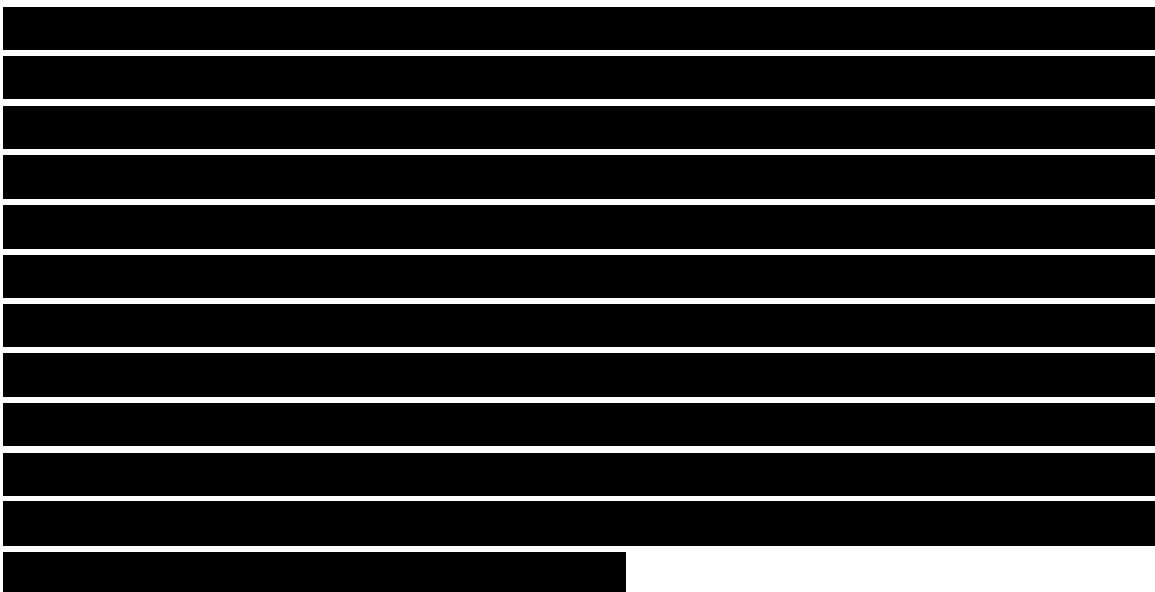
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]





REFERENCES

- [1] M. Sheik-Bahae, *et al.*, Sensitive measurement of optical nonlinearities using a single beam, *IEEE J. Quant. Elect.* 26, 760, (1990)
- [2] T. Godin, M *et al.*, Baryscan: a sensitive and user-friendly alternative to Z-scan for weak nonlinearities measurements, *Opt. Lett.* 36, 8, (2011)
- [3] M. R. Ferdinandus, *et al.*, Dual-arm Z-scan technique to extract dilute solute nonlinearities from solution measurements, *Opt. Mat. Express* 2, 12, (2012)
- [4] K. Fedus and G. Boudebs, Sensitivity of the 4f coherent imaging system used in degenerate multi-wave mixing experiments, *J. Opt. Soc. Am. B*, 26, 2, 244, (2009).
- [5] K. Fedus, G. Boudebs, Experimental techniques using 4f coherent imaging system for measuring nonlinear refraction, *Optics Communications* 292, 140, (2013).
- [6] P. Chen, *et al.*, Two-dimensional Z scan for arbitrary beam shape and sample thickness, *J. Appl. Phys.* 85, 7043, (1999)
- [7] G. Tsigaridas, *et al.*, V. Giannetas, Z-scan technique through beam radius measurements, *Appl. Phys. B* 76, 83, (2003)
- [8] G. Boudebs, *et al.*, Third-order susceptibility measurements by nonlinear image processing *J. Opt. Soc. Am. B*, 13, 145013, (1996),
- [9] G. Boudebs, *et al.*, Contrast increasing by third-order nonlinear image processing: a numerical study for microscopic rectangular objects, *Optics Communications*, 150, 287, (1998).
- [10] K. Fedus, G. Boudebs, and H. Leblond, Degenerate multi-wave mixing inside a 4f imaging system in presence of nonlinear absorption, *Applied Physics B-Lasers and Optics*, 100, 4, 827, (2010).
- [11] G. Boudebs, K.Fedus, Absolute measurement of the nonlinear refractive indices of reference materials, *J. Appl. Phys.* 105, 103106, (2009)
- [12] ISO Standard 11146, Lasers and laser-related equipment – Test methods for laser beam widths, divergence angles and beam propagation ratios, (2005), http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=33626,